# kwan-tek

# Magnétométrie NV pour le Contrôle non Destructif

Kwan-tek

Baptiste Vindolet, ingénieur R&D

baptiste.Vindolet@kwan-tek.com

18-09-2024

## KWAN-TEK: a Quantum Sensing Deep Tech Startup

© Founded in April 2020 (Lorient, France) after 13 years experience in quantum metrology





Metrology solutions based on diamond quantum sensors



First French SME developing diamond quantum sensors identified by the **European strategy in quantum technologies** 

7 Patents

24 staff

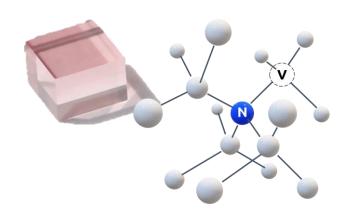
- 17 in R&D
- including 5 PhD
- All skills present

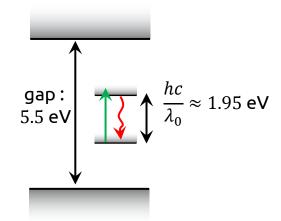


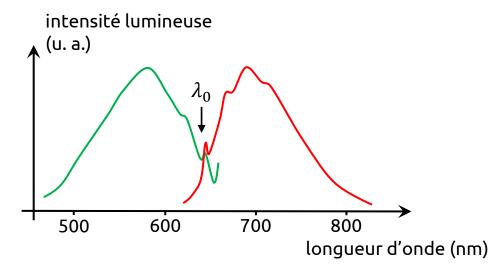


## Le centre NV du diamant

Le centre NV est défaut atomique du diamant, parfaitement photostable

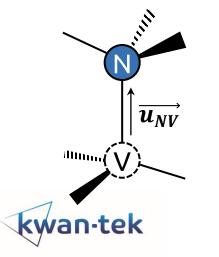


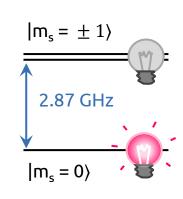




NV : Nitrogen Vacancy

Spin électronique S=1, adressable optiquement



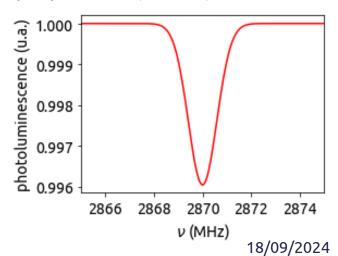


#### 2 propriétés fondamentales :

Sous illumination verte

- Initialisation dans  $|m_s = 0\rangle$
- Lecture optique

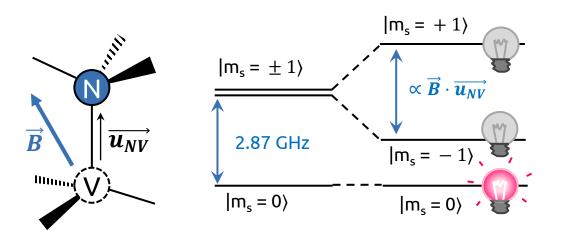
Résonance magnétique détectée optiquement (ODMR)

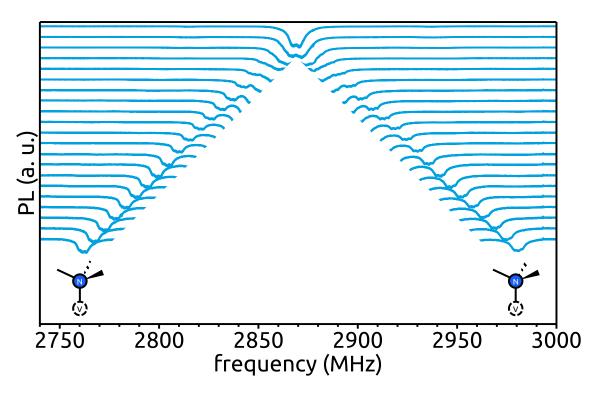


Confidentiel

## Magnétométrie NV

En présence d'un champ magnétique : levée de dégénérescence entre + 1 et -1 (effet Zeeman)

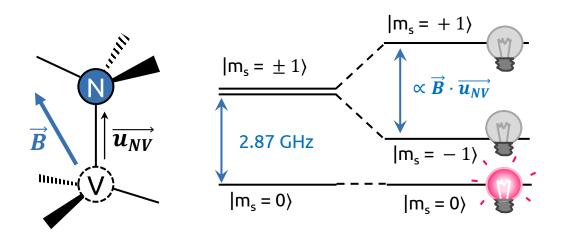


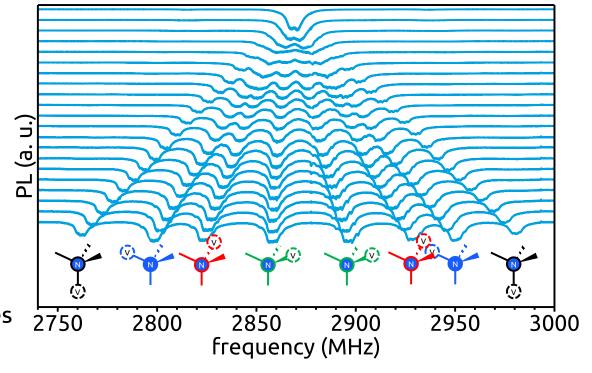




## Magnétométrie NV

En présence d'un champ magnétique : levée de dégénérescence entre + 1 et -1 (effet Zeeman)





Cas d'un diamant très dopé : 4 orientations possibles, ie. 4 paires de résonances

#### Un diamant massif est un excellent magnétomètre

- Haute résolution, petite dimension (10 ~ 100 µm)
- Vectoriel (3 axes)

- Quantitatif et absolu (pas de calibration)
- Sensible (≤ nT/√Hz)
- Robuste



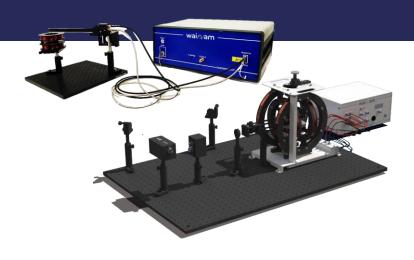
## Développement de nouvelles applications

Un diamant massif est un excellent magnétomètre (résolu, sensible, sans calibration, robuste)

Instrumentation scientifique et enseignement

Navigation & détection

Contrôle non destructif





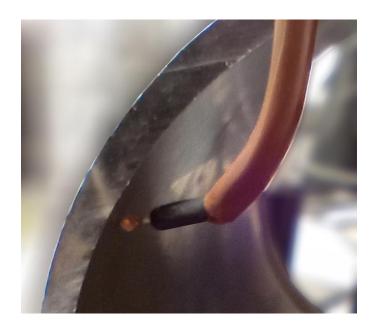




## Magnétométrie NV pour le CND

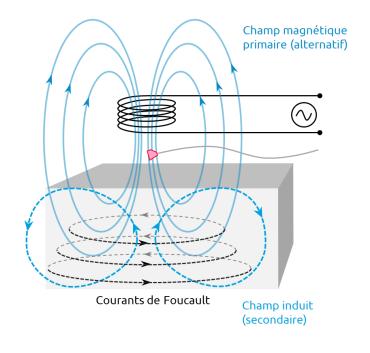
But : utiliser le NV comme capteur dans les méthodes de contrôle reposant sur le champ magnétique

#### Mesure de champs de fuite (MFL)



Premières preuves de principe Optimisation et automatisation en cours

#### Courants de Foucault



Développement en cours



## Magnétométrie NV - mesure de champs de fuite

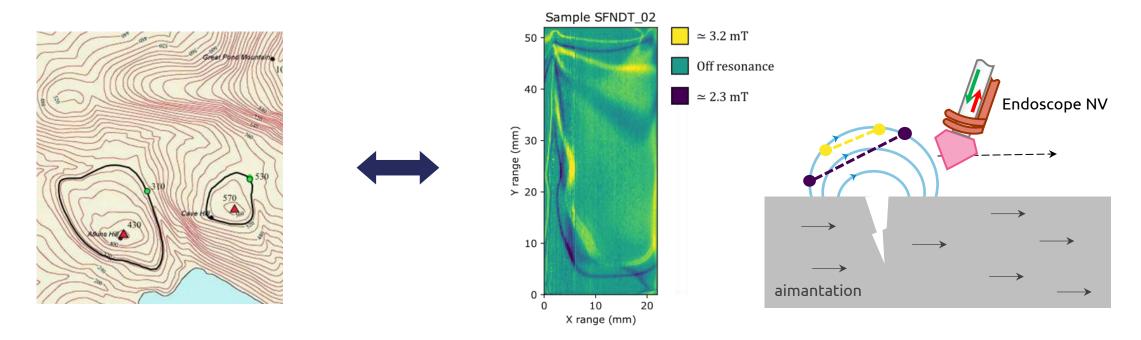
Principe: des défauts ponctuels (fissures, contraintes, ...) dans une pièce en acier donnent lieu à des champs de fuite (dès que  $\operatorname{div}(\overrightarrow{M}) \neq 0$ )

**Objectif** : scanner un magnétomètre à proximité de la pièce pour mesurer les champs de fuite et détecter les défauts. Banc de test Laser \_ (a) Fiber Antenna Diamond Stray field an-tek Confidentiel 18/09/2024

## Cartes rapides: iso-champ (iso-B)

Les cartes de champ sont obtenues en fixant la fréquence micro-onde.

On observe des **contours de champ**, correspondant à une valeur et une projection du champ magnétique. Cf. cartes de relief.



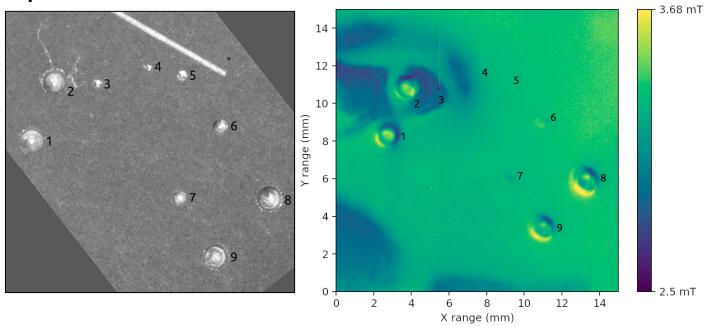
Une carte iso-champ avec un capteur massif contient l'information magnétique, de manière vectorielle et quantitative.

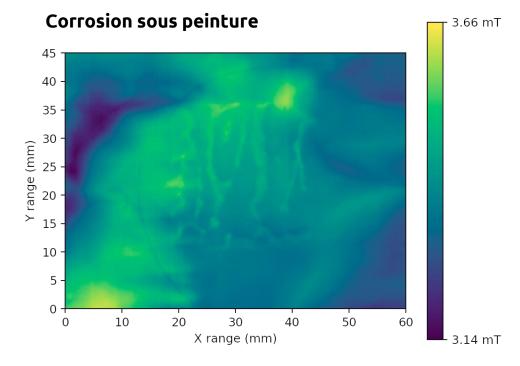


## Exemple de résultats (1)

### Détection et quantification de petits défauts par imagerie de champ de fuite

#### Piqûre de corrosion





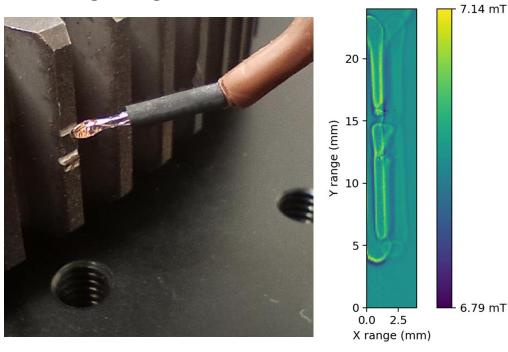
Trous de diamètres compris entre 200 µm et 1.4 mm.

Images réalisées à remanence.

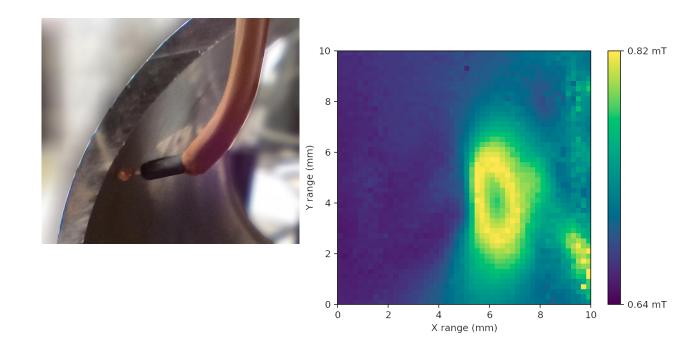


## Exemple de résultats (2) Défauts dans des géométries complexes

#### Dent d'engrenange abîmée



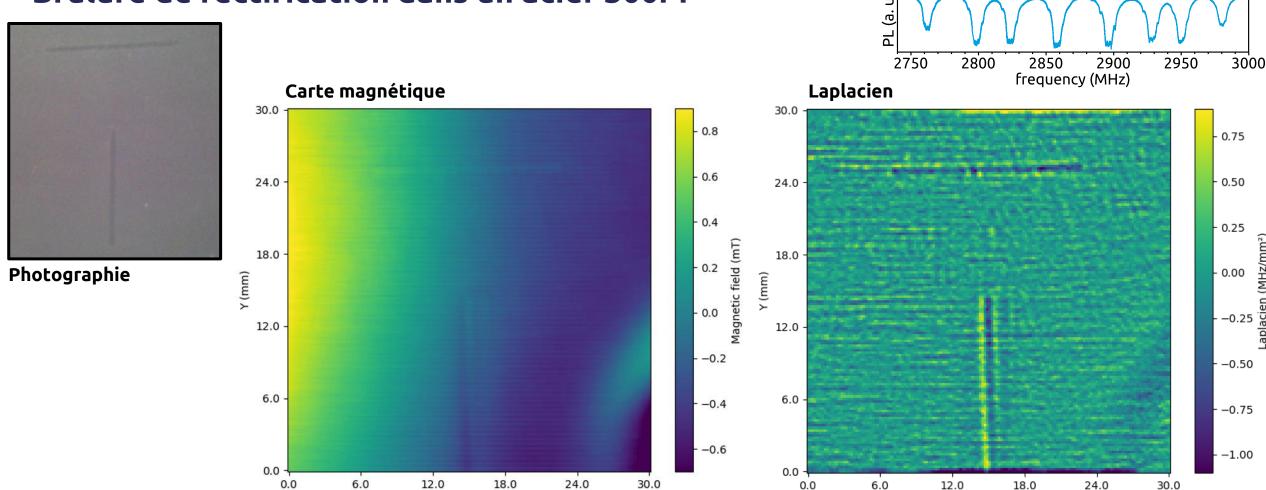
#### Trou sub-millimétrique dans un tube en acier 300M





## Cartes rapides et quantitative : Suivi de la raie ODMR

Brûlure de rectification dans un acier 300M





X (mm)



X (mm)

## Intérêts de la magnétométrie NV pour la MFL

#### Détection efficace et fiable

- Grande sensibilité (< nT/√Hz)</li>
- Grande résolution (< 10 µm atteignable)</li>
- Capteur magnétique quantitatif et sans calibration
  - Mesure digitale

#### Implémentation simple

- Sonde de petite dimension (~mm) => accès à des géométries difficiles
  - Prêt à utiliser (pas besoin de couplant, de préparation)
- Détection au travers des couches de peinture, revêtements...



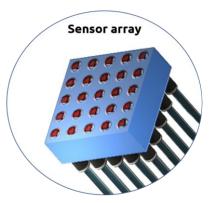
## Magnétométrie NV – champs de fuite

#### Prochaines étapes :

- → Mesures limitées par le déplacement mécanique (inspection d'une pièce en quelques secondes) :
  - Augmenter la cadence des mesures (limitation fondamentale à 1 10 MHz).
  - Améliorer les performances (sensibilité, résolution) en perfectionnant les endoscopes.
  - Matrice de capteurs modulaire.

#### → Interprétation directe :

- Modéliser les défauts
- Scanner des banques de défauts



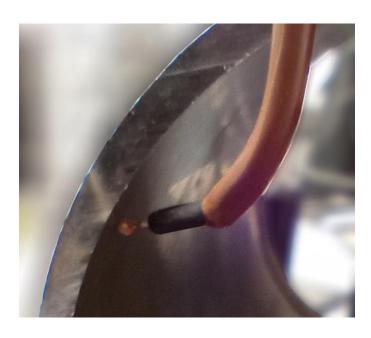
Brevet n° WO/2023/285402



## Magnétométrie NV pour le CND

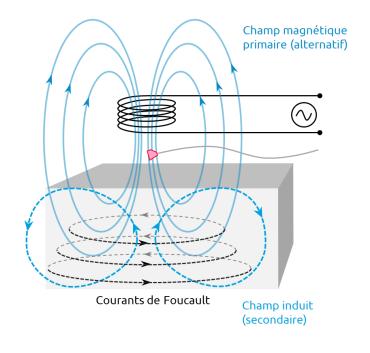
But : utiliser le NV comme capteur dans les méthodes de contrôle reposant sur le champ magnétique

#### Mesure de champs de fuite (MFL)



Premières preuves de principe Optimisation et automatisation en cours

#### Courants de Foucault



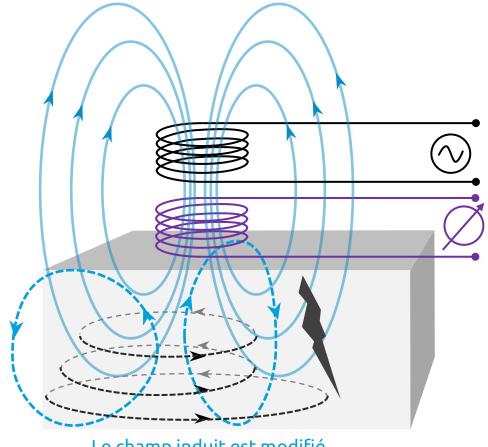
Développement en cours



## Principe d'une mesure par courants de Foucault

## Matériau sain Champ magnétique primaire Bobine d'excitation Récepteur Courants de Foucault Champ induit

#### Présence d'un défaut



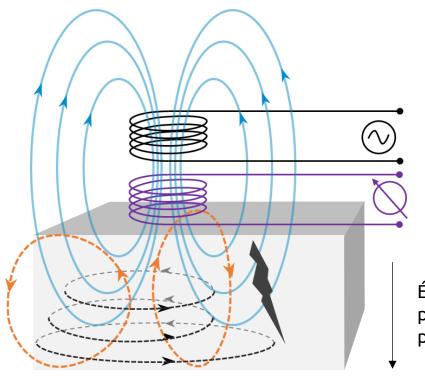
Le champ induit est modifié



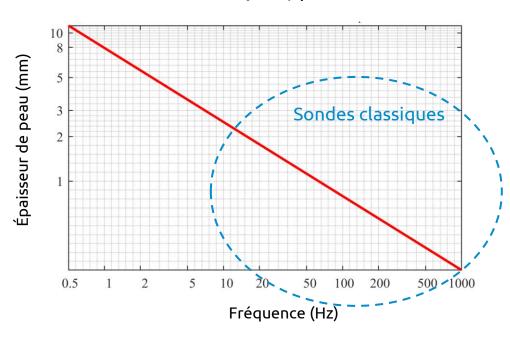
Confidentiel 18/09/2024

## Principe d'une mesure par courants de Foucault

 $\rightarrow$  On peut sonder différentes profondeurs du matériau en faisant varier la fréquence d'excitation.



Épaisseur de peau : profondeur de pénétration du champ Exemple - acier 300M  $\sigma = 4 \cdot 10^6$  S/m,  $\mu_r = 1000$ 

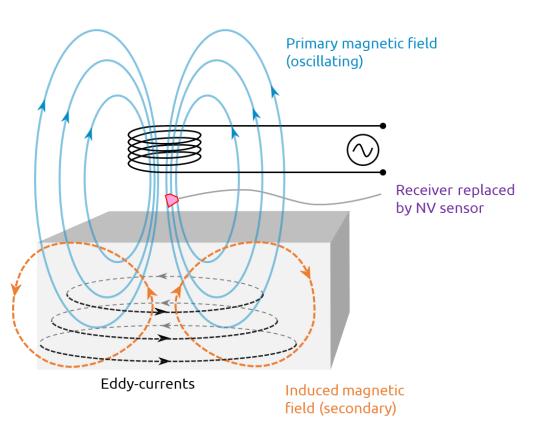


 $\Rightarrow$  Il faut diminuer la fréquence pour mesurer plus en profondeur dans les acier. Le signal  $B_{induit}$  est plus faible et le bruit augmente (bruit en 1/f).



## NV pour les courants de Foucault

#### Avantages NV pour les courants de Foucaults :



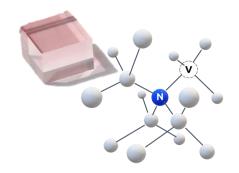
- Augmenter la resolution (compromis sensibilité/resolution avec les capteurs classiques).
- Augmenter la profondeur de mesure (limitation en sensibilité à basse fréquence avec les capteurs classiques).

	Classical sensors	NV
Profondeur de mesure (ex. acier)	~ 1-3 mm	~ 10 mm
Résolution en champ magnétique	~ 1 mm	< 100 µm



Confidentiel 18/09/2024 19

## Conclusion



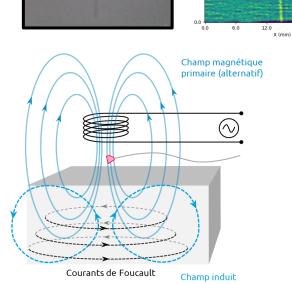
Les centres NV du diamant combinent plusieurs avantages : grande resolution ( $\leq$  100 µm), sensible (< nT/ $\sqrt{Hz}$ ), implémentation simple et sans calibration.



 Nous tirons profit des avantages du NV pour le contrôle non destructif de défauts dans des pieces métalliques (trains d'atterrissage, brûlure de rectification, couche blanche etc.).

#### Prochaines étapes :

- Automatisation et optimisation des mesures de champs de fuite par magnétométrie NV sur des cas d'usages précis.
- Intégration des mesures par courants de Foucault.





Confidentiel 18/09/2024

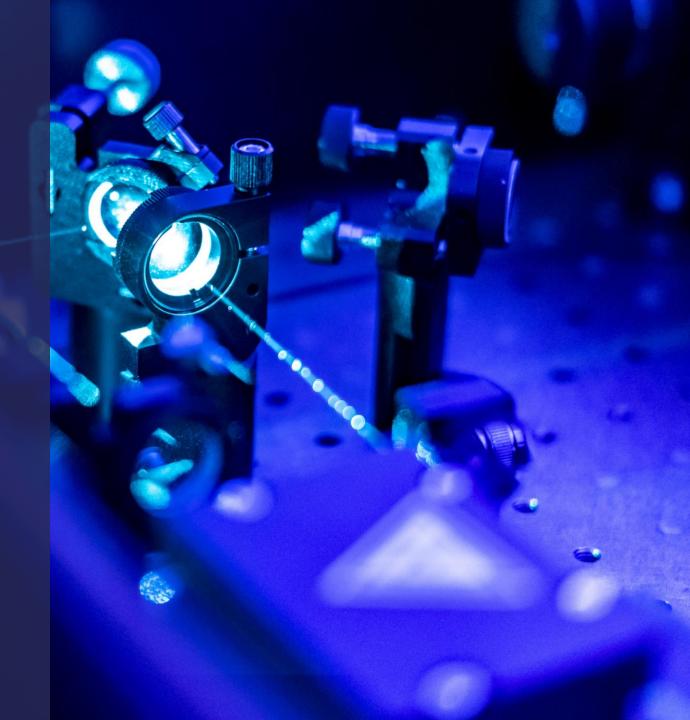


Visit our website ...



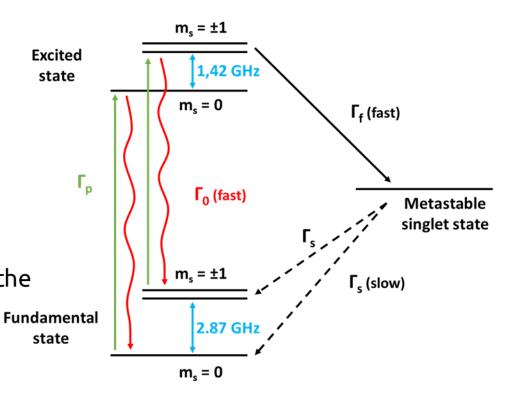
Your contact email address here or sales@KWAN-TEK.com

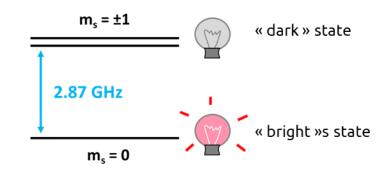
Appendix: technical slides



## **NV** centre atomic levels

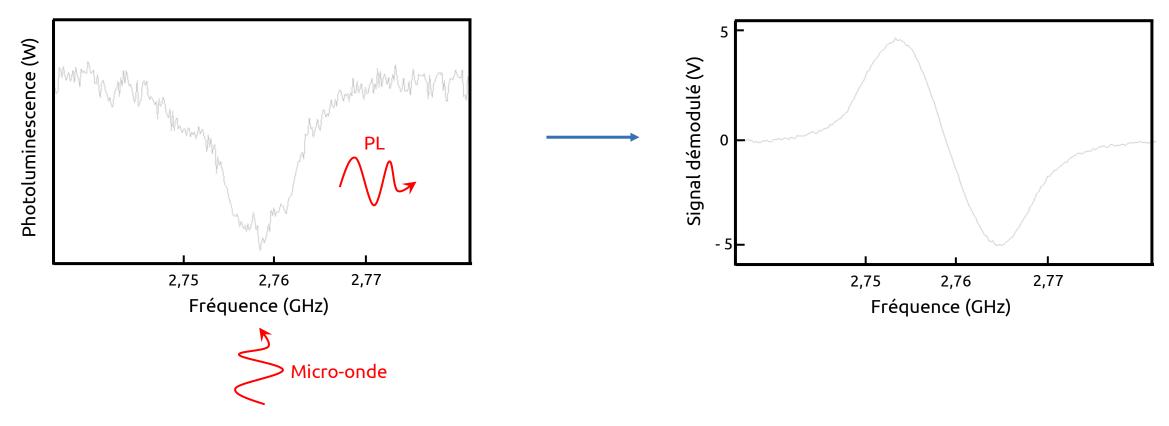
- The NV centre has an overall electron spin S=1.
- The ground and excited states are electron spin triplets, characterised by the quantum number, which can take on the values 0, +1 or -1.
- A NV centre in the m<sub>s</sub> = 0 state will tend to cycle between the excited and ground states.
- A NV centre in the excited m<sub>s</sub> = ±1 states has a non-negligible probability of decaying into the metastable state, without emitting a red photon.
- Under green light excitation, the NV centre exhibits two important properties:
  - the NV centre polarises in the  $m_s = 0$  state
  - the m<sub>s</sub> = 0 state emits more light than the m<sub>s</sub> = ±1 states







## Tracking de la raie ODMR



- On module la fréquence micro-onde autour de la raie ODMR.
- On fait une rétroaction PID sur la fréquence micro-onde pour maintenir l'amplitude du signal démodulé à  $0 \text{ V} \rightarrow \text{On suit la position de la raie en continue !}$

## Exemples récents dans la littérature

#### Burst Eddy Current Testing with a Diamond Magnetometry

Chang Xu<sup>1</sup>, Jixing Zhang<sup>1\*</sup>, Heng Yuan<sup>1,2\*</sup>, Guodong Bian<sup>1</sup>, Pengcheng Fan<sup>1</sup>, and Minxin Li<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>School of Instrumentation and Optoelectronic Engineering, Beihang University, Beijing 100191, China;

<sup>2</sup>Research Institute of Frontier Science, Beihang University, Beijing 100191, China;

\*zhangjixing@buaa.edu.cn; hengyuan@buaa.edu.cn.

